

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 23 年 1 月 27 日 (2011.1.27)

【公開番号】特開 2008-160105 (P2008-160105A)
 【公開日】平成 20 年 7 月 10 日 (2008.7.10)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-027
 【出願番号】特願 2007-321888 (P2007-321888)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 3/10 (2006.01)

B 4 1 J 29/46 (2006.01)

B 0 5 C 11/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/10 D

B 4 1 J 29/46 A

B 0 5 C 11/00

【手続補正書】

【提出日】平成 22 年 12 月 8 日 (2010.12.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

印刷処理方向と各プリントヘッド上に 1 つ又はそれ以上のエゼクタを備えた 1 つ又はそれ以上のプリントヘッドとを有する印刷システムを用いて、基板上に印刷スポットで滑らかなマイクロスケール形状を形成する方法であって、

前記印刷スポットの半径を決定し、

試験パターンを生成し、

前記印刷システムで前記試験パターンを印刷し、

前記印刷された試験パターンを、液滴の拡がり及びラインの滑らかさに関して分析するステップ、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項 2】

前記印刷された試験パターンを分析するステップが、前記試験パターンの既知の位置について、

(a) ライン幅を表す性能指数を計算し、

(b) 粗さを表す性能指数値を計算し、

(c) 最適なライン幅と粗さが達成されたか否かを判定し、

(d) 前記粗さが許容できなければ、前記基板をポストバークするステップ、を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

データ処理装置上で実行可能であり、且つ、印刷処理方向と各プリントヘッド上に 1 つ又はそれ以上のエゼクタを備えた 1 つ又はそれ以上のプリントヘッドとを有する印刷システムを用いて基板上に印刷スポットで滑らかなマイクロスケール形状を形成するために使用可能な、1 組のプログラム命令を格納する記憶媒体であって、

スポット配置ピッチと前記印刷スポットの半径とを決定するための命令と、

試験パターンを生成するための命令と、

前記印刷システムで前記試験パターンを印刷するための命令と、
前記印刷された試験パターンを、液滴の拡がり及びラインの滑らかさに関して分析するための命令と、
を含むことを特徴とする記憶媒体。

【請求項 4】

前記試験パターンは、スポット配置ピッチ及び隣接する液滴のタイミングにおける変動を示す、様々なスポット配置のスポット特性の連続パターンを備える請求項 3 に記載の記憶媒体。

【請求項 5】

前記 1 組のプログラム命令は、更に、滑らかなライン縁部の形状と狭いライン幅を生成するための最適なスポット配置を決定するため、試験パターンの前記決定又は前記分析のためのアルゴリズムを備える請求項 3 に記載の記憶媒体。